

# Tchip 厂测工具使用说明

v1.0

## 一、功能测试

### 1. 测试前需要做的准备工作：

三个 U 盘/SD 卡/两台显示器/两台设备/音箱/光纤线

测试前将启动测试需要的加密配置文件（见 2）拷贝至其中一个 U 盘。

测试连接：将所有 USB 接口插入 U 盘；SD 接口插入 SD 卡；SPDIF 接口通过光纤线连接到 SPDIF 设备；CVBS 接口连接一台电视（电视为 AV 模式）；HDMI 输出接口接入另一台电视（电视为 HDMI 模式），HDMI IN 接口连接另一台设备的 HDMI OUT 输出接口。最后接通电源。

测试需要注意的事项：

#### USB

检测结果描述栏中 USB1 为设备内置的 flash，其他为连接的 USB 设备。

#### LED

连续按 menu 按钮数次，观察 LED 灯是否间断闪烁，如果是，则表示测试成功。

#### SPDIF

声音输出接口，若 SPDIF 设备输出声音表示测试成功。

#### HDMI\_IN

测试该项目时，电视显示切换到 HDMI\_IN 设备显示上，屏幕会再次切回来，则表示测试成功。

#### CVBS

手动测试。请观察屏幕，测试项会自动切换至 CVBS 输出。若此时接 HDMI 的屏幕熄灭，接 CVBS 的屏幕显示，则表示测试成功。

2. 配置文件 Factoty\_Test.ini 需要修改的地方有 wifi\_ap 和 password 两个属性值，

设置好后,打开 EncryptTool 目录下的 EncryptTool 可执行程序,点击加密,选择配置文件,会在该配置文件相同目录下生成 Factory\_Test\_Signed.bin 文件,将文件重命名为 Factory\_Test.bin。

3.将 Factory\_Test.bin 文件拷贝至 SDCard 或 U 盘跟目录,程序自动执行,进行功能项测试。

## 二、老化测试

1.老化测试需要使用的配置文件 Aging\_Test.ini, 配置说明如下:

[FactoryTest]

required = 0 /////是否必须通过工嫩嫩高测试后, 才能进行老化测试

///// 1: 必须通过功能测试, 0: 不必通过功能测试

若将测试放置在 U 盘或 SDCard 中,在大量量产时,工厂需要准备大量 U 盘

或 SDCard,故将测试片源已内置在固件/system/usr/目录下,无需再次拷贝。[注:默认片源路径为

/system/usr/Aging\_Test\_Video.mp4]

2.加密配置文件, 操作与功能测试一致, 生成 Aging\_Test.bin 文件

3.将 Aging\_Test.bin 文件拷贝至 SDCard 或 U 盘跟目录, 将其插入设备即可自动开启老化测试。

## 三、写号

1.写号需要使用的配置文件 SN\_Test.ini。配置说明如下:

[ADB]

adb\_enable = 1 /////开启或关闭 ADB

1:开启,0:关闭

2.加密配置文件,操作与功能测试一致,生成 SN\_Test.bin 文件

3.将 SN\_Test.bin 文件拷贝至 SDCard 或 U 盘根目录,将 SDCard 或 U 盘插入设备即可自动开启

ADB 以备写号。写号是由其他工具实现的,本操作只配合开启 ADB 功能。

注意:三个配置文件放在同一个 U 盘内,默认只启动功能测试。